

登録に係る区分：密度・屈折率

法律に基づく初回認定年月日又は初回登録年月日：平成 25 年 9 月 5 日

国際 MRA 対応初回認定年月日：平成 25 年 9 月 5 日

校正手法の区分の呼称[登録年月日]：固体密度標準器等[平成 25 年 9 月 5 日]、浮ひょう[平成 25 年 9 月 5 日]

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正

校正手法の 区分の呼称	種類	校正範囲	最高測定能力 ( $k=2$ )
固体密度 標準器等	シリコン単結晶	2.000 g/cm <sup>3</sup> 以上 3.000 g/cm <sup>3</sup> 以下	0.0001 g/cm <sup>3</sup>
	固体（金属・ガラス などを含む）	3.000 g/cm <sup>3</sup> 以上 22.000 g/cm <sup>3</sup> 以下	0.0025 g/cm <sup>3</sup>
浮ひょう	密度浮ひょう （衡量法）	0.600 g/cm <sup>3</sup> 以上 2.000 g/cm <sup>3</sup> 以下	0.00020 g/cm <sup>3</sup>
	比重浮ひょう （衡量法）	0.600 以上 2.000 以下	0.00020
	酒精度浮ひょう （衡量法）	0 vol% 以上 100 vol% 以下	0.1 vol%
	重ポーム度浮ひょう （衡量法）	0 重ポーム度 以上 72 重ポーム度 以下	0.1 重ポーム度
	日本酒度浮ひょう （衡量法）	-40 日本酒度 以上 30 日本酒度 以下	1 日本酒度